# 恢复已老化压电陶瓷性能的方法

#### 李全禄

(陕西师大应用声学研究所)

本文简要介绍了用重新极化的方法, 使已老化的压电陶瓷元件的某些 性能 得 到 恢复。

## 一、引言

用于制造超声换能器, 电声器件等的压 电陶瓷, 其性能将随着时间的推移和环境条 件的变化而变化,有时这种变化相当显著, 甚至造成压电陶瓷元件不能使用。其主要原 因是压电陶瓷元件的时间老 化,根 据 文献 [1]—[5]对时间老 化 的论述和推 理, 一 般 认为极化以后压电陶瓷的性能随存放时间延 长而产生变化, 存放时间愈长总的变化量愈 大,但变化速度会逐渐减缓下来,此变化是 不可逆的。对于国内某几家厂在七十年代和 八十年代生产的各种类型、不同规格的PZT 晶片,至今因性能变差而影响使用;也有从 国外进口仪器上替换下来的压电陶瓷,如目 本海上电机株式会社生产的电车探测器上换 下来的 $\phi$ 30×10和 $\phi$ 10×10S型PZT, 其性能 已经很差。为了使这些已老化的压电晶体不 至于报废。本文采用了对已老化的PZT晶片 进行重新极化的方法, 使其某些性能得到恢 复,並能在实际工作中继续使用。

## 二、试验情况

#### 重新极化

- 1.查清已老化晶片原出厂时的性能参数 (见原厂"压电陶瓷性能测试报告单")及出厂 年月。
  - 2.对已老化的压电晶体,用高阻摇表估

- 计一下其体电阻值,将电阻率太小( $ρ_* < 10^9$  Ω.cm)的剔出,其它的准备重新极化。
- 3.重新极化前,测试该晶片现有的性能参数,区分晶片原来的正负极,如果正负极。区分不开,需要重新标定正负极后才能进行极化。
- 4. 重新极化是在极化装置上进行的,本 文对 PZT、PMN 晶片进行 重新 极 化,具 体条件见表1。

表1 PZ、TPMN晶片的重新极化条件

类 型	电压 V (KV/mm)	温度 T (℃)	时间 t (min)	
PZT-SF	3.3~4.1	115~135	1 <b>0~</b> 15	
PZT—F	3.0~4.0	110~120	10~15	
PZT-4	3.1~3.6	100~110	1 <b>0~</b> 15	
PZT5	1.6~2.1	140~150	10~15	
PM N	3.1~3.6	125~145	10~15	

#### 恢复电极面

对于长时间因环境,机械损伤等原因造成电极面变坏的压电晶片,在恢复了电极面 后再进行极化。

- 1.把电极面变色,特别是因焊接连线而使电极面银层不平的晶片挑出,用砂纸磨去或在10%的硝酸溶液中去掉不能用的电极面。
  - 2. 清洗晶片
- 3. 进行烧渗银上电极具体制作过程。参 照文献(6)中的烧渗银工艺进行。
  - 4. 出炉后用高阻摇表 测量 晶片的体 电

阻,以确定能否重新极化。

5.对确定重新极化者,编上号,标明正、 负电极,准备重新极化。

## 三、结果与分析

在重新极化的大量PZT晶片中,只有  $\phi$  20×1和 $\phi$ 18×0.8的两类晶片符合 直径  $\phi$ 与 厚度t之比不小于10 ( $\phi$ /t  $\geq$ 10)。对于 PZT —SF型晶片中的 $\phi$ 18×0.8晶片在重新极 化 6天之后,采用传输线法,测 出晶片的串联

谐振频率(指共振频率) $f_{s0}$ 、一次 泛音 频率  $f_{si}$ 、并联谐振频率 $f_{p}$ (指反共振频率)和 串联 谐振时等效阻抗 $R_{io}$  用TYP1007电 容 电桥 测出晶片电容 $C^{T}$ 。然后根据文献(7),  $f_{si}$ / $f_{so}$  就可从图中查出 $\sigma^{E}$ ,由 $f_{p}-f_{so}$ / $f_{so}$ 即 可以从表中查到平面耦合系数 $K_{p}$ 值;从公式  $Q_{m} \approx \frac{1}{4\pi(f_{p}-f_{so})C^{T}R_{1}}$ 计算出对应的  $Q_{m}$  值。表 2 是晶片在1979年3月出厂时"压电陶瓷性能测试报告单"上的数据,重新极化前 测的 数据和重新极化放置6天后测得数据的对照表。

喪2	PZT-SF型晶片先后性能参数对照表	
~~-		

性能参数	fso	fp	f_1	Ст	R <sub>1</sub>	Кp	Q <sub>m</sub>
时间顺序	(K <sub>c</sub> )	(Ke)	(K <sub>c</sub> )	(pf)	(Ω)		
出厂时(1979年3月)	117.03	未报道	未报道	4200	未报道	0,55	未报道
重极化前(1989年10月)	122.2	133,5	311.7	3283.8	117.5	0.448	24.5
重极化后(1989年10月)	119.2	135.2	319.2	3573.1	95,6	0,59	132

注,性能参数均取被测晶片参数的平均数。

对φ20×1一组晶片也进行了 系 统 的测试分析,与表2中所列参数有类似的 变化 趋势。

对于其它类型和不同规格的大量晶片都进行了重新极化,实践证明,经过重新极化 后的晶片,用于制作收发兼用的超声换能器和大功率超声加工(如超声清洗 和超 声粉碎等)换能器,其工作状态良好。

## 四、结 语

本工作的良好效果说明了用恢复电极面和重新极化的方法,可以使已老化的压电陶瓷晶片某些性能恢复到实用程度,如表2所示重新极化后的PZT—SF型晶片的K,和Q\_值达到了使用要求。

### 参考文献

- [1] 许煜寰等编《铁电与压电材料》科学出版 社,1978,P188
- [2] 何芳钧等编著,《压电陶瓷滤波器》科学出版社, P149
- [3] [日]田中哲郎等編,陈俊彦、王余君译 《压电陶瓷材料》国家海洋局第五研究所 1977, P56
- [4] [美]B, 贾菲等著, 林声和译,《压压陶瓷》科学出版社, 1979, P80
- [5] 张沛霖、张仲渊编,《压电测量》, 国防工业出版社, 1983, P312
- [6] 李全禄,"氧化物超导材料上电极的两种 方法"《物理》(即将发表)
- [7] "压电原理及应用"中国人民解放军武字 262部队1971年P31下84